(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. September 2004 (30.09.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/083110 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01L 9/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/002817
- (22) Internationales Anmeldedatum:

18. März 2004 (18.03.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

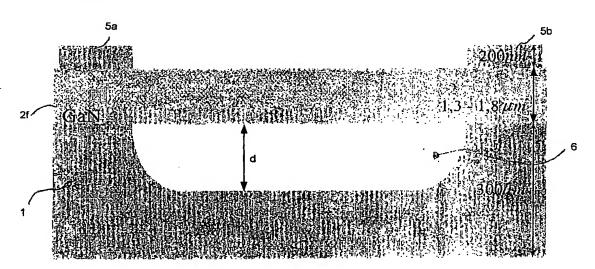
- (30) Angaben zur Priorität: 103 11 757.1 18. März 2003 (18.03.2003) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MICROGAN GMBH [DE/DE]; Albert-Einstein-Allee 45, 89081 Ulm (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KUNZE, Mike [DE/DE]; Heimstrasse 16, 89250 Senden (DE). DAU-MILLER, Ingo [DE/DE]; Obere Weiherstrasse 1, 89165 Dietenheim (DE). BENKART, Peter [DE/DE]; Kirchbergstrasse 12, 86447 Stotzard (DE). KOHN, Erhard [DE/DE]; Radgebweg 21, 89081 Ulm/Lehr (DE).
- (74) Anwalt: PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR; Mozartstrasse 17, 80336 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SENSOR ELEMENT WITH SELF-SUPPORTING BAR STRUCTURES MADE OF GROUP III NITRIDE BASED SEMICONDUCTORS

(54) Bezeichnung: SENSORELEMENTE MIT FREITRAGENDEN BALKENSTRUKTUREN AUS HALBLEITERN AUF GRUPPE-III-NITRIDBASIS



- (57) Abstract: The invention relates to a sensor element which comprises a group III nitride-based semiconductor structure. The semiconductor sensor element is used to determine pressure, temperature, a force, a deflection or an acceleration. It comprises a substrate base (1), a group III nitride based homogeneous semiconductor layer arranged thereon, whereby the surface of homogeneous semiconductor layer (2, 2f) facing the substrate base (1) is arranged at least partially at a distance to the surface of the substrate base facing the homogeneous semiconductor layer (2, 2f). The invention is characterized in that at least two electric terminal contacts (5) used to divert an electric output signal which can be produced by the homogeneous semiconductor layer (2, 2f), said contacts being arranged on and/or below the homogeneous semiconductor layer (2, 2f) or integrated therein.
- (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Sensorelement, das eine Halbleiterstruktur auf Gruppe III-Nitridbasis aufweist. Das Halbleitersensorelement dient der Bestimmung des Drucks, der Temperatur, einer Kraft, einer Auslenkung oder einer Beschleunigung. Es

FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 24. März 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

weist eine Substratbasis 1, darauf angeordnet eine homogene Halbleiterschicht auf Gruppe-III Nitridbasis auf, wobei die der Substratbasis 1 zugewandte Oberfläche der homogener Halbleiterschicht 2, 2f zumindest teilweise einen Abstand zu der der homogenen Halbleiterschicht 2, 2f zugewandten Oberfläche der Substratbasis aufweist und zeichnet sich dadurch aus, dass mindestens zwei elektrische Ableitungskontakte 5 zur Ableitung eines durch die homogene Halbleiterschicht 2, 2f erzeugbaren elektrischen Ausgangssignals auf, an und/oder unter der homogenen Halbleiterschicht 2, 2f angeordnet sind oder in diese integriert sind.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No	
T/EP2004/002817	

_			1-61/EP2004/00281/
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G01L9/00		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classification $G01L$	on symbols)	
Documentar	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are inclu	uded in the fields searched
	ata base con sulted during the international search (name of data bas	se and, where practical,	l, search terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	•	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
A	US 2002/066319 A1 (STRITTMATTER R ET AL) 6 June 2002 (2002-06-06) paragraph '0019! - paragraph '003 figures 1-3		1,50,53
A	YOUTSEY C ET AL: "Dopant-selecti photoenhanced wet etching of GaN" JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS T vol. 27, no. 4, 30 April 1998 (1998-04-30), pages XPOO 2312123 ISSN: 0361-5235 the whole document	1,50,53	
	-	-/	
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family r	members are listed in annex.
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		or priority date and cited to understan invention "X" document of partice cannot be consided involve an invention "Y" document of partice cannot be consided document is combuments, such combin the art. "&" document member	blished after the international filing date and not in conflict with the application but and the principle or theory underlying the cular relevance; the claimed invention ered novel or cannot be considered to expect the comment is taken alone cular relevance; the claimed invention ered to involve an inventive step when the bined with one or more other such docubination being obvious to a person skilled or of the same patent family
	actual completion of the international search 9 January 2005	26/01/2	the international search report
<u> </u>	malling address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL 2280 HV Rijswijk Tet. (+3170) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+3 170) 340-3016	Segerbe	erg, T

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No F/EP2004/002817

•		1/EP2004	7 002017
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	F	Relevant to claim No.
T	CASE WESTERN RESERVE UNIVERISTY: "Silicon-Carbide-Based 400 C MEMS Sensing and Data Telemetry" ELECTRICAL ENIGINEERING COMPUTER SCIENCE, 'Online! 16 July 2004 (2004-07-16), XP002312125 Retrieved from the Internet: URL:http://vorlon.eecs.cwru.edu/{rxw54/research.htm> 'retrieved on 2004-12-29! abstract		1,50,53

INTERNALIONAL SEARCH REPORT



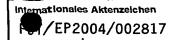
Information on patent family members

International Application No F/EP2004/002817

Patent document cited in search report		Publication date	Patent fa member	Publicatio n date
US 2002066319	A1	06-06-2002	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT





A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G01L9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfst off (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) I PK $\,\,7\,$ G01L

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teille	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2002/066319 A1 (STRITTMATTER ROBERT P ET AL) 6. Juni 2002 (2002-06-06) Absatz '0019! - Absatz '0031!; Abbildungen 1-3	1,50,53
A	YOUTSEY C ET AL: "Dopant-selective photoenhanced wet etching of GaN" JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS TMS USA, Bd. 27, Nr. 4, 30. April 1998 (1998-04-30), Seiten 282-287, XP002312123 ISSN: O361-5235 das ganze Dokument	1,50,53

Weitere Veröffentlichu ngen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Slehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das je doch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchen bericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamille ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internatio nalen Recherchenberichts
19. Januar 2005	26/01/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bedlenstete r
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Segerberg, T

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT





		Fer/EP20	004/002817
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
T	CASE WESTERN RESERVE UNIVERISTY: "Silicon-Carbide-Based 400 C MEMS Sensing and Data Telemetry" ELECTRICAL ENIGINEERING COMPUTER SCIENCE, 'Online! 16. Juli 2004 (2004-07-16), XP002312125 Gefunden im Internet: URL:http://vorlon.eecs.cwru.edu/{rxw54/research.htm> 'gefunden am 2004-12-29! Zusammenfassung		1,50,53

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlistengen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
Por/EP2004/002817

lm Recherchenbericht		Datum der	Mitglied(er) der	Datum der		
angeführtes Patentdokument		Veröffentlichung	Patentfamilie	Veröffentlichung		
	US 2002066319	A1	06-06-2002	KEINE		